

Metrologia di un satellite complesso

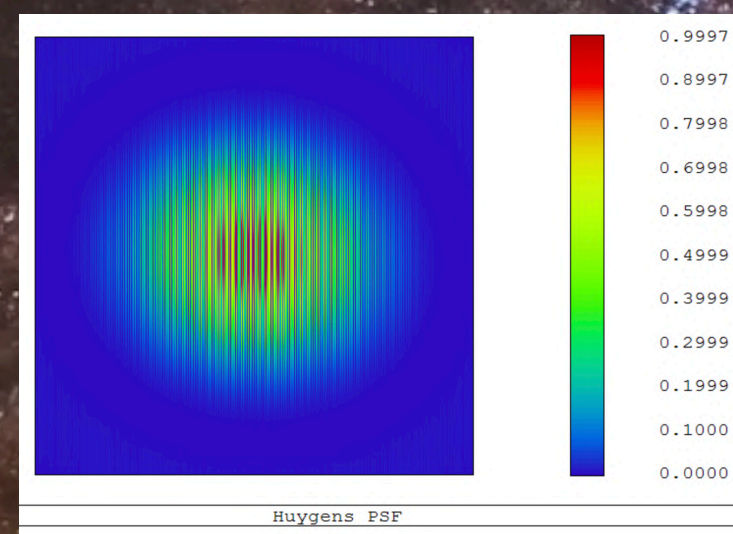
- Misura e analisi di variazioni sistematiche di Gaia
- Basic Angle Monitoring Device
- Analisi di lungo termine
- Modellizzazione di effetti al picoradiante
- Applied Fourier analysis
- Data mining

Contatto:

Alberto Riva

alberto.riva@inaf.it

011 8101936



Esperienza in team multidisciplinare
e internazionale

